

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH • Merianstraße 28 • 63069 Offenbach

NXP Semiconductors Czech
Republic s.r.o.
Herr Jozef Sedlak
1. Maje 1009
756 61 ROZNOV POD RADHOSTEM
Czech Republic

Offenbach, 2020-02-27

Ihr Zeichen	Ihr Schreiben 2019-11-27	Unser Zeichen - bitte angeben 5016540-4970-0005/268246 TL2/scb	Ansprechpartner Herr Dipl.-Ing. Schildbach Tel +49 69 8306 524 Fax +49 69 8306 789 joachim.schildbach@vde.com
-------------	-----------------------------	--	---

Translation: In any case the German version shall prevail

PR Ü F B E R I C H T zur Information des Auftraggebers *Test Report for the Information of the applicant*

Produkt / Product: *Mikro-Controller*

Typ / Type: *LPC55Sxx*

Sehr geehrte Damen und Herren,

dieser Prüfbericht enthält das Ergebnis einer einmaligen Untersuchung an dem zur Prüfung vorgelegten Erzeugnis. Ein Muster dieses Erzeugnisses wurde geprüft, um die Übereinstimmung mit den nachfolgend aufgeführten Normen bzw. Abschnitten von Normen festzustellen.
Die Prüfung wurde durchgeführt vom 2020-02-04 bis 2020-02-27.

This test report contains the result of a singular investigation carried out on the product submitted. A sample of this product was tested to found the accordance with the thereafter listed standards or clauses of standards resp. The testing was carried out from 2020-02-04 to 2020-02-27.

Der Prüfbericht berechtigt Sie nicht zur Benutzung eines Zertifizierungszeichens des VDE und berücksichtigt ausschließlich die Anforderungen der unten genannten Regelwerke.

The test report does not entitle for the use of a VDE Certification Mark and considers solely the requirements of the specifications mentioned below.



Wenn gegenüber Dritten auf diesen Prüfbericht Bezug genommen wird, muss dieser Prüfbericht in voller Länge an gleicher Stelle verfügbar gemacht werden.

Whenever reference is made to this test report towards third party, this test report shall be made available on the very spot in full length.

I BESCHREIBUNG / DESCRIPTION

Produkt / Product: Selbst-Diagnose-Routinen für Milro-Controller Familie der Typen
Self-Diagnostic Routines for Micro Controller Family Types

LPC55Sxx

Typ / Type:	Dateiname / File name	Version / Version
	iec60730b_cm33_reg.S	4.x
	iec60730b_cm33_reg_fpu.S	4.x
	iec60730b_cm33_pc.S	4.x
	iec60730b_cm33_pc_object.S	4.x
	iec60730b_clock.c	4.x
	iec60730b_cm33_flash.S	4.x
	iec60730b_cm33_ram.S	4.x
	iec60730b_dio.c	4.x
	iec60730b_dio_ext.c	4.x
	iec60730b_aio.c	4.x
	IEC60730_CM33_Class_B_IAR_v4_0.a*	4.x
	IEC60730_CM33_Class_B_KEIL_v4_0.lib*	4.x
	libIEC60730_CM33_Class_B_MCUX_v4_0.a*	4.x

Remark: The files marked with * are object code files.



II NORMEN / STANDARD

Prüfnorm(en) / Standard(s) used:

DIN EN 60335-1 (VDE 0700-1):2012-10	EN 60335-1:2012
DIN EN 60335-1 Ber.1 (VDE 0700-1 Ber.1):2014-04	EN 60335-1:2012/AC:2014
DIN EN 60335-1/A13 (VDE 0700-1/A13):2018- 07	EN 60335-1:2012/A11:2014 EN 60335-1:2012/A13:2017
Annex R	EN 60335-1:2012/A1:2019 EN 60335-1:2012/A14:2019 EN 60335-1:2012/A2:2019 Annex R
DIN EN 60730-1 (VDE 0631-1):2017-05	EN 60730-1:2016 EN 60730-1:2016/A1:2019
Annex H	Annex H
IEC 60335-1:2010	
IEC 60335-1:2010/AMD1:2013	
IEC 60335-1:2010/AMD2:2015	
Annex R	
IEC 60730-1:2013	
IEC 60730-1:2013/AMD1:2015	
Annex H	



III PRÜFUNG / TEST

Die unter I benannten Selbst-Diagnose-Routinen sind vorgesehen für folgende Maßnahmen nach Tabelle R.1 / H.1 der unter II benannten Normen. /

The self-diagnostic routines mentioned under I are foreseen for following measures of table R.1 / H.1 of the standards mentioned under II.

Dateiname / File name	Maßnahme / Measure
iec60730b_cm33_reg.S iec60730b_cm33_reg_fpu.S	1.1 Register
iec60730b_cm33_pc.S iec60730b_cm33_pc_object.S	1.3 Programme counter
iec60730b_clock.c	3. Clock
iec60730b_cm33_flash.S	4.1 Invariable memory
iec60730b_cm33_ram.S	4.2 Variable memory
iec60730b_dio.c iec60730b_dio_ext.c	7.1 Digital I/O (for output mode only)
iec60730b_aio.c	7.2.1 A/D- and D/A- converter

Zu Details der Prüfungen siehe VDE-Prüfbericht /
For details of testing see VDE Test Report:

268246-TL2-1



IV ERGEBNIS / RESULT

Die unter I benannten Selbst-Diagnose-Routinen erfüllen die Anforderungen der unter II benannten Normen. Die unter I benannten Selbst-Diagnose-Routinen können zum Aufbau einer Selbst-Test-Bibliothek gemäß der unter II benannten Normen verwendet werden. /

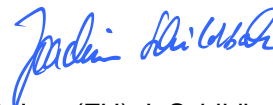
The self-diagnostic routines mentioned under I fulfill the requirements of the standards mentioned under II. The self-diagnostic routines mentioned under I are suitable to be used to create a self-test library according to the standards mentioned under II.

Best regards

VDE Testing- and Certification Institute
Appliances and Systems for House and Commercial Use



Dipl.-Ing. (FH) K. Tas



Dipl.-Ing. (FH) J. Schildbach

